

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-20100-01-00 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gültig ab: 27.06.2022

Ausstellungsdatum: 27.06.2022

Urkundeninhaber:

encontec GmbH
Marie-Curie-Straße 19, 73529 Schwäbisch Gmünd

am Standort:

Leobener Straße 104, 70469 Stuttgart

Prüfungen in den Bereichen:

Härteprüfung nach Vickers an metallischen Werkstoffen;
visuelle Prüfung und Vermessung von elektronischen Erzeugnissen mit der Mikroskopie,
2-dimensionale Vermessung von Rissen in Schliiffbildern mit der Mikroskopie

Innerhalb der mit * gekennzeichneten Akkreditierungsbereiche ist dem Prüflaboratorium, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkKS bedarf, die Anwendung der hier aufgeführten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet. Das Prüflaboratorium verfügt über eine aktuelle Liste aller Prüfverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Prüflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Die Urkunde samt Urkundenanlage gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand des Geltungsbereiches der Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAkKS) zu entnehmen. <https://www.dakks.de/content/datenbank-akkreditierter-stellen>

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-20100-01-00

1 Härteprüfung nach Vickers an metallischen Werkstoffen *

DIN EN ISO 6507-1 Metallische Werkstoffe - Härteprüfung nach Vickers - Teil 1:
2018-07 Prüfverfahren

2 Visuelle Prüfung und Vermessung von elektronischen Erzeugnissen mit der Mikroskopie

IPC A-610 Abnahmekriterien für elektronische Baugruppen
Revision F (hier: *Kapitel 4, 5, 7, 8, 9, 10*)
2014-07

PV 01 V2.00 2-dimensionale Vermessung von Rissen in Schliffbildern mittels
2022-03 Mikroskopie

PV 02 V2.00 Visuelle Begutachtung von elektronischen Erzeugnissen mittels
2022-03 Stereomikroskopie

Verwendete Abkürzungen:

DIN	Deutsches Institut für Normung e. V.
EN	Europäische Norm
IEC	International Electrotechnical Commission
ISO	International Organization for Standardization
IPC	Normative Dokumente der Association Connecting Electronics Industries
PV	Hausverfahren der encotec GmbH